



Система рентгенодефектоскопии высокого разрешения FSX-090

Установка **Verifer HR (FSX-090)** – предназначена для проведения рентгеновского анализа с высоким разрешением и увеличением. Разработана специально для быстрой и интуитивной работы. Позволяет выполнять обнаружение широкого спектра дефектов начиная с подробного вида внутренних соединений полупроводниковых структур (соединений проводников/кристаллов) до анализа паяных соединений печатных плат.

Основные Характеристики

- Простота в использовании
- Высочайшее разрешение
- Многофункциональное средство анализа
- Увеличение более 650X
- Источник и приемник рентгеновского излучения высокого разрешения
- Энергия достаточная для анализа самых сложных устройств
- Изменяемая система крепления образцов
- Занимает небольшую площадь/ портативная конструкция

Легкая управляемость

Интуитивные органы управления и отображения такие как: Вкл/Выкл, Усиление, Увеличение, Фокус, Блокировка.



Универсальная оправка крепления образцов

- Ручной X/Y позиционер образцов
- Регулируемое крепление: до 16" x 18"
- Переменный угол : Обзора: 0 - 30°
- 360° Поворотная рамка (опция)



Технические характеристики

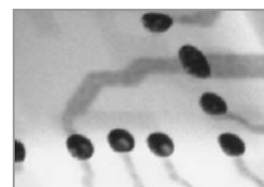
Площадь	32" x 34"
Размер образцов	до 16" x 18"
Угол обзора	до 30° (в стандартном варианте) 360° в поворотном приспособлении для небольших образцов
Источник рентгеновского излучения	90 к В, 5 микрон микрофокус
Увеличение	> 650x
Периферийное оборудование	Цветной струйный принтер 15" монитор (17" опция) 10/100 Base-T Ethernet (сеть)

Программное обеспечение / обработка изображений

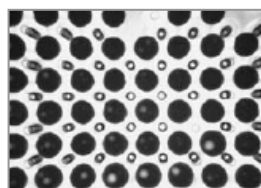
- ОС Windows™ XP
- ПО (стандартное)
 - Live frame averaging
 - Text annotation
 - Image saving / printing utilities
- ПО для анализа BGA (опция)
- XAIP Advanced Image Processor (опция)



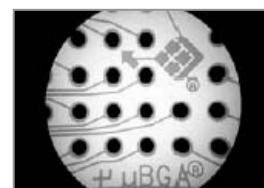
Микросварка



Флип Чип



BGA



µBGA